

MODEL 58212-C

特点

- 高速及高精度测试
- 支援水平结构、垂直结构和倒装型芯片
- 支援到8英寸晶圆
- 支援不同电性测试范围 (LD或LED)
- 精准快速对位的扫描程序
- 支援多点测试功能 (multi-site)
- 支援auto load/unload

测试项目

- 电性量测:
 - 阈值电流 Threshold Current (Ith)
 - 顺向电压 Forward Voltage (Vf)
 - 漏电流 Reverse leakage Current (Ir)
 - 逆向崩溃电压 Reverse Breakdown Voltage (Vrb)
- 光特性量测:
 - 光功率 Optical Power
 - 中心波长 Centre Wavelength (Wc)
 - 峰值波长 Peak Wavelength (Wp)
 - 半峰全宽 Full Width at Half Maximum (FWHM)

硬件设备

- 自动化晶圆芯片点测设备
- 电性测试模组
- 光学测试模组
- 选配ESD测试模组(LED适用)

光电元件点测机 MODEL 58212-C

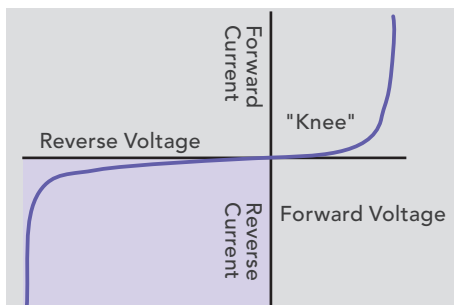
Chroma 58212-C是一台具备精准控温、多点测试、自动化的外延片 (Epitaxial Wafer) / 芯片 (Chip) 探测针光电应用测试设备, 提供快速且准确的光电性能量测, 广泛的应用于雷射二极管 (Laser Diode) 和发光二极管 (Light-Emitting Diode) 等产品。

58212-C的点测系统采用了灵活的设计, 提供不同类型的光电元件测试, 包括水平结构 (Lateral)、垂直结构 (Vertical) 和倒装晶片 (Flip Chip); 测试前的扫描程序可提供完整的晶圆扫描图以保证测试的精度; 专利探针头可防止待测物刮伤并确保每一个芯片接触。

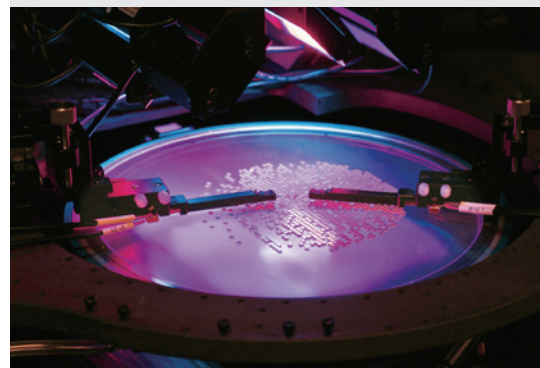
此机型提供多点测试 (multi-site) 设计, 透过客制化的架构可支援一次下针测试多点位置, 此设计可稳定测试并节省测试时间, 增加测试效能。

透过致茂的独特光学设计可取得精确且稳定快速的光学数据, 如: 光功率、中心波长、峰值波长、半峰全宽及色温等, 量测光学的同时也可获取电性数据, 如: 顺向电流、顺向电压、漏电流、逆向崩溃电压、斜率效率、光电转换效率等, 以上光电测试皆在一次下针的时间内完成。

软体操作介面及先进的逻辑演算法, 可使得生产效率大幅提升; 完善的测试报表与良率统计供使用者轻松掌握生产状况。



I-V Curve



Chroma

规格表

Model	58212-C	
Application		
Test Area	ψ 8 inch wafer	
Wafer Size	Chip on wafer: 2", 4", 6", 8" Chip on tape : 2", 4", 6"	
Chuck Type (A chuck is decided by a device type)	Lateral type, Vertical type, and Flip chip type (select one of them)	
Die Size	6 ~ 120mil	
Pad Size	≥ 50μm	
Operating Temperature	25°C ~ 85°C / 0°C ~ 100°C	
Electrical Measurements		
Measurement Items	Threshold Current (Ith), Forward Voltage (Vf), Reverse leakage Current (Ir), Reverse Breakdown Voltage (Vrb)	
Current Range	± 6A (≤ 5V & Pulse Mode Only), ± 3.5A (≤ 5V), ± 2.5A (≤ 10V), ± 1A, ± 100mA, ± 10mA, ± 1mA, ± 100μA, ± 10μA, ± 1μA	
Driving Mode	CW and Pulsing	
Pulse Width	Min. 100μs (depending on the DUT, pulse width may need to be longer to have stable voltage and power readings)	
Duty Cycle	< 10% (when I=2.5A~3.5A, pulse width ≤ 5ms, voltage < 5V) (Heat dissipation affects the pulse duty cycle constraint)	
Optical Measurements		
Measurement Items	Optical Power, Centre Wavelength (Wc), Peak Wavelength (Wp), Full Width at Half Maximum (FWHM)	
Optical Power	Range	0.5mW~500mW
	Repeatability	≤ 3%
Wavelength	Range	UVC to NIR (Further discussion is possible on other ranges)
	Repeatability (FWHM)	≤ ± 0.3nm
Facility Requirements		
Machine Dimension	1160mm (L) x 1240mm (W) x 1500mm (H)	
Power Requirement	Single phase, 220VAC ± 10%, 50/60Hz, 20A	
Input Air	-0.2 Mpa / ψ 6 mm	
Weight	750 kg	
Environment	Temperature	20°C ~ 30°C
	Humidity	40% ~ 70%

* 所有规格如有更新恕不另行通知。

订购资讯

58212-C: 光电元件点测机

下载Chroma ATE APP，取得更多产品与全球经销资讯



iOS



百度应用商城

Search Keyword

58212-C

总公司
致茂电子股份有限公司
333001桃园市龟山区
文茂路88号
T +886-3-327-9999
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

中国
中茂电子(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区
登良路南油天安工业村
4号厂房8F
PC : 518052
T +86-755-2664-4598
F +86-755-2641-9620
www.chromaate.com
info@chromaate.com

东莞服务部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896

北京分公司
T +86-10-5764-9600/5764-9601
F +86-10-5764-9609

重庆办公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

致茂电子(苏州)有限公司
江苏省苏州高新区珠江路
855号狮山工业廊7号厂房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

厦门分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

中茂电子(上海)有限公司
上海市钦江路333号40号楼3楼
T +86-21-6495-9900
F +86-21-6495-3964